# α-Si:H ƏSASINDA GÜNƏŞ ELEMENTLƏRİNDƏ GEDƏN EMİSSİYA PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİ

E.Ə. KƏRİMOV, S.N. MUSAYEVA

Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, AZ-1073, H. Cavid pros. 25. E-mail: <u>E\_Kerimov.fizik@mail.ru</u>

Qadağan zonasındakı hallarda tutulan yük daşıyıcıların  $\rho_{trap}$  qiymətləndirilməsi üçün donor- və akseptorabənzər və  $\alpha$ -Si:H yürüklük dəliyində amfoter tipli halların modelləri istifadə olunmuşdur. Keçiricilik zonasının quyruğundakı halların akseptorabənzər olduğu qəbul edilmişdir: bu hallar elektronlarla tutulduqada mənfi, elektrondan azad olduğu haıda isə neytraldır. Valent zonanın quyruğunda hallar özünü donorabənzər kimi aparır, zonaların quyruğunda donora- və akseptorabənzər hallar isə eksponensial paylanmaya malikdir.

Açar sözlər: günəş enerjisi, silisium, yük daşıyıcılar, tələlər, donor, akseptor, amfoter, elektron-deşik cütlüyü. UOT: 666.9-129 PACS: 73.40.Ns, 73.40.Sx, 72.10.-d

Günəş elementlərinin yaradılması üçün  $\alpha$ -Si:H təbəqələrinin istifadə olunmasında əsas rolu bu təbəqələrin optik udmasının kristallik silisiumda olduğundan 20 dəfə artıq olması faktı oynamışdır. Görünən günəş işiğının əhəmiyyətli dərəcədə udulması üçün maya dəyəri kifayət qədər yüksək olan 300 mkm qalınlıqlı silisium altlıqların istifadə olunması əvəzinə 0,5 - 1,0 mkm qalınlıqlı  $\alpha$ -Si:H təbəqələrin alınması kifayətdir. Bundan əlavə, böyük sahəyə malik ifrat nazik təbəqə şəklində amorf silisiumun alınması mümkünlüyü daha perspektivli sayılır və texnoloji imkanlar daha yüksək qiymətləndirilir. Monokristallik silisium əsasında günəş batareyalarının elementlərinin hazırlanması zamanı baxılan texnologiyada kəsilmə, pardaxlama və polirə olunmaqla bağlı texniki itkilər mövcud deyildir.

Amorf silisiumda Fermi kvazisəviyyələri keçirici zonaların sərhədlərindən 2kT qiymətindən daha çox geri qalır. Belə yarımkeçirici üçün Bolsman statistikası ödənilir və sərbəst yük daşıyıcıların konsentrasiyasını aşağıdakı ifadə ilə təyin etmək olur [1]:

$$n = N_C \cdot exp[(E_{fn} - E_C)];$$
  
$$p = N_V \cdot exp[(E_V - E_{fp})].$$

Qırılmış rabitələrlə şərtlənən hallar amfoter təbiətli qəbul edilir, yəni donora-, və ya akseptorabənzər hallarda ola bilir: Müsbət yüklənmiş (elektrondan azad), neytral (bu halda bir elektron mövcuddur) və mənfi (iki elektron vardır). Baxılan halda qırılmış rabitə yürüklük dəliyində iki elektrik səviyyəsinin yaranmasına gətirir:  $E^{+,0}$  səviyyəsi +/0 keçidinə,  $E^{0/-}$  səviyyəsi isə 0/- keçidinə uyğun gəlir. İki səviyyə arasındakı məsafəyə, artıq bir elektronla tutulmuş halda ikinci elektronun peyda olmasına lazım olan enerji ( $E_U$  korrelyasiya enerjisi) uyğun gəlir. Amorf yarımkeçiricilərin enerji zonalarının strukturlarının Mott və Devis modelində qırılmış rabitələrlə şərtlənən hallar qaus paylanmasına malikdirlər [2].

Bu halda yük və donora- və akseptorabənzər hallarda uyğun olaraq belə təyin olunacaq:

$$\begin{aligned} \rho_{d} &= q \int_{E_{V}}^{E_{C}} N(E) [1 - f(E)] dE; \\ \rho_{a} &= -q \int_{E_{V}}^{E_{C}} N(E) f(E) dE, \end{aligned}$$

burada, f(E) – enerji səviyyəsinin elektronla dolma ehtimalıdır.

Amfoter tipli hallarda yük isə belə hesablanır:

$$\rho_{at} = q \int_{E_V}^{E_C} N(E) [F^+(E) - F^-(E)] dE,$$

burada,  $F^+(E)$ ,  $F^-(E)$  – uyğun olaraq, sərbəst və ikiqat tutulmuş vəziyyətdə halların tapılma ehtimallarıdır.

Sadə halda – arxa elektroddan işığın əks olunması mövcud olmadıqda generasiyanın sürəti belə ifadə olunur:

$$G = G_0 \cdot \alpha(\lambda) \cdot exp[\alpha(\lambda)x],$$

burada,  $G_0$  – dalğa uzunluğu  $\lambda$  olan düşən şüalanmanın intensivliyi;  $\alpha(\lambda)$  – udulma əmsalı; x – günəş elementinin səthindən olan məsafədir.

Arxa elektroddan işığın əks olunması zamanı isə generasiya

$$G = \frac{G_0 \alpha(\lambda)}{1 - P} [exp(-\alpha x) + Pexp(\alpha x)],$$

olacaqdır. Burada, P – buraxılma əmsalıdır.

Amorf yarımkeçirici üçün rekombinasiya sürəti bütün hallar üzrə – rekombinasiya sürətinin valent zonanın tavanından keçiricilik zonasının dibinə qədər inteqrallanması ilə hesablana bilər. Əgər  $\eta r(E)$  rekombinasiya effektivliyi *E* enerjili vahid halda rekombinasiya sürəti kimi təyin olunarsa, rekombinasiyanın ümumi sürəti belə yazıla bilər:

$$R = \int_{E_V}^{E_C} N(E) \eta_r(E) dE,$$

131, H.Javid ave, AZ-1143, Baku Institute of Physics E-mail: jophphysics@gmail.com burada, N(E) – yarımkeçiricinin yürüklük dəliyində hallar sıxlığıdır.



*Şəkil 1.* Diskret enerji səviyyənin tutulması və emissiya prosesləri.

Yük daşıyıcıların tutulması və emissiyasının yalnız yayılmış və lokallaşmış hallar arasında baş verdiyinin qəbul olunması, donora- və akseptorabənzər hallarda rekombinasiya proseslərinin təsviri üçün Şokli-Rid-Holl statistikasını istifadə etməyə imkan verir [3, 4]. Bu statistikaya uyğun olaraq diskret enerji səviyyəsinin tutulmasını – iki tutulma və iki emissiya proses təyin edir (şəkil 1):  $r_1$ ,  $r_4$  – uyğun olaraq  $E_t$  səviyyəsinə elektron və deşiyin tutulma sürəti,  $r_2$  və  $r_3$  isə elektron və deşiyin emissiya sürətləridir.

Cədvəl 1-də donora- və akseptorabənzər hallara elektron və deşiklərin bütün emissiya və tutulma prosesləri xarakterizə olunmuşdur. Cədvəl 1-də  $T_a$  və  $T_d$  – uyğun olaraq akseptora və donarabənzər hallar;  $v_{th}$  – yük daşıyıcıların istilik sürəti,  $N_t$  – tələlərin konsentrasiyası;  $\sigma_n^+$ ,  $\sigma_p^0$  – uyğun olaraq elektron və deşik üçün tələnin tutma en kəsiyi;  $e_n^-$ ,  $e_p^0$  – isə uyğun olaraq tutulmuş elektron və tələnin emissiya əmsalıdır. Cədvəldə yer alan «+», «0» və «–» indeksləri tələnin yük halını göstərir.

Cədvəl 1.

Donor- və akseptorabənzər hallarda elektron və deşiklərin tutulması və emissiya prosesləri

Proses	Keçid	Prosesin sürəti
T <sub>d</sub> <sup>+</sup> halında elektronun tutulması	$T_d^+ + e \rightarrow T_d^0$	$r_1 = nv_{th}\sigma_n^+ N_t (1-f)$
Ta <sup>0</sup> halında elektronun tutulması	$T_a^0 + e \rightarrow T_a^-$	$r_2 = n v_{th} \sigma_n^0 N_t (1 - f)$
T <sub>d</sub> <sup>0</sup> halında deşiklərin tutulması	$T_d^0 + h \rightarrow T_d^+$	$r_3 = p v_{th} \sigma_p^0 N_t f$
Ta <sup>-</sup> halında elektronun tutulması	$T_a^- + h \rightarrow T_a^0$	$r_3 = p v_{th} \sigma_p^- N_t f$
Td <sup>0</sup> halında elektronun emissiyası	$T_d^0 \rightarrow T_d^+ + e$	$r_2 = e_n^0 N_t f$
Ta <sup>-</sup> halında elektronun emissiyası	$T_a^- \rightarrow T_a^0 + e$	$r_2 = e_n^- N_t f$
T <sub>d</sub> <sup>+</sup> halında deşiklərin emissiyası	$T_d^+ \rightarrow T_d^0 + h$	$r_4 = e_p^+ N_t (1 - f)$
Ta <sup>0</sup> halında deşiklərin emissiyası	$T_a^0 \to T_a^- + h$	$r_4 = e_p^0 N_t (1 - f)$

Termodinamik tarazlıq halında detal tarazlıq prinsipinə uyğun olaraq  $r_1 = r_2$  və  $r_3 = r_4$  olacaqdır. Bu zaman halın dolma ehtimalı Fermi-Dirak funksiyası ilə təsvir olunur:

$$f = [1 + exp(E_t - E_F)]^{-1}.$$

Bu ifadədən emissiya əmsalları belə ifadə olunacaqlar:

$$e_n^0 = v_{th} \sigma_n^+ N_C exp\left(\frac{E_t - E_C}{kT}\right),$$
$$e_n^+ = v_{th} \sigma_n^0 N_V exp\left(\frac{E_V - E_t}{kT}\right).$$

Son ifadəni və emissiya və tutulma sürətləri üçün ifadələri nəzərə alaraq tutulma funksiyasını ala bilərik:

 $R = r_1 - r_2 = r_3 - r_4.$ 

Rekombinasiyanın ümumi sürəti belə yazılır:

$$f = \frac{nv_{th}\sigma_n^+ + e_p^+}{nv_{th}\sigma_n^+ + pv_{th}\sigma_p^0 + e_n^0 + e_p^+}.$$
 (2)

(1)

(1) ifadəsini  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  və  $r_4$  üçün olan tənlikdə nəzərə alsaq rekombinasiya effektivliyini təyin edə bilərik:

$$\eta_r = \frac{R}{N_t} = v_{th}^2 \sigma_n^+ \sigma_p^0 \frac{np - n_i^2}{nv_{th}\sigma_n^+ + pv_{th}\sigma_p^0 + e_n^0 + e_p^+}.$$

Teylor və Simmons (2) ifadəsinin aşağıdakı ifadə ilə approksimasiya olunmasını göstərmişlər:

$$f = \frac{nv_{th}\sigma_n^+}{nv_{th}\sigma_n^+ + pv_{th}\sigma_p^0 + e_n^0}$$
(3)

Deşiklərin dolma funksiyası belə yazılır:

$$1-f = \frac{pv_{th}\sigma_n^+}{nv_{th}\sigma_n^+ + pv_{th}\sigma_p^0 + e_n^0}.$$

(3) ifadəsi aşağıdakı kimi çevrilə bilər:

$$f = \frac{n\sigma_n^+}{n\sigma_n^+ + p\sigma_p^0} \left[ 1 + \frac{e_n^0}{nv_{th}\sigma_n^+ + pv_{th}\sigma_p^0} \right]^{-1}$$

Bu halda kvadrat mötərizə içində olan kəmiyyət Fermi-Dirak funksiyası olacaqdır. Deməli:

$$f = \frac{n\sigma_n^+}{n\sigma_n^+ + p\sigma_p^0} \left[ 1 + exp\left(\frac{E_t - E_{fnt}}{kT}\right) \right]^{-1}$$

Tutulmuş elektronlar üçün Fermi kvazisəviyyəsi:

$$E_{fnt} = E_C + kT ln \left( \frac{n\sigma_n^+ + p\sigma_p^0}{N_C \sigma_n^+} \right).$$

Analoji olaraq deşiklərin dolma funksiyası:

$$1 - f = \frac{p\sigma_p^0}{n\sigma_n^+ + p\sigma_p^0} \left[ 1 + exp\left(\frac{E_{fpt} - E_t}{kT}\right) \right]^{-1}$$

Tutukmuş deşiklərin Fermi Fermi kvazisəıviyyəsi:

$$E_{fpt} = E_V - kT ln \left( \frac{n \sigma_n^+ + p \sigma_p^0}{N_V \sigma_p^0} \right).$$

Rekombinasiyanın effektivliyi üçün alırıq:

$$E_{t} > E_{t0} \ olduqda \quad \eta_{r} = v_{th} \frac{\sigma_{n}^{+} \sigma_{p}^{0} np}{n\sigma_{n}^{+} + p\sigma_{p}^{0}} \Big[ 1 + exp \left( \frac{E_{t} - E_{fnt}}{kT} \right) \Big]^{-1}$$
$$E_{t} < E_{t0} \ olduqda \quad \eta_{r} = v_{th} \frac{\sigma_{n}^{+} \sigma_{p}^{0} np}{n\sigma_{n}^{+} + p\sigma_{p}^{0}} \Big[ 1 + exp \left( \frac{E_{fpt} - E_{t}}{kT} \right) \Big]^{-1}.$$

Bu ifadələrdə *E*<sub>t0</sub> elektron və deşiklərin emissiya əmsallarının bərabər olduğu səviyyəyə uyğun gəlir:

$$E_{t0} = \frac{E_V + E_C}{2} - \frac{kT}{2} ln \left( \frac{\sigma_n^+ N_C}{\sigma_p^0 N_V} \right).$$

 $\eta_r$  üçün olan ifadəni istifadə edərək, Fermi-Dirak funksiyasını K temperaturda approksmasiya etməklə rekombinasiya sürəti üçün aşağıdakı ifadəni ala bilərik:

$$R = v_{th} \frac{\sigma_n^+ \sigma_p^0 n p}{n \sigma_n^+ + p \sigma_p^0} \int_{E_V}^{E_{fpt}} N(E) dE.$$

Belə olan halda lokallaşmış hallarda tutulan yük aşağıdakı ifadə ilə hesablanacaqdır:

$$\rho = -q \left( \int_{E_V}^{E_{fpt}} N(E) dE + \frac{n\sigma_n^+}{n\sigma_n^+ + p\sigma_p^0} \int_{E_{fpt}}^{E_{fpn}} N(E) dE \right).$$

#### E.Ə. KƏRİMOV, S.N. MUSAYEVA

Amfoter tipli hallarda rekombinasiya prosesləri Sax və Şokli tərəfindən nəzəri tədqiq edilmişdir. Şəkil 2-də belə hallarda elektron və deşiklərin emissiya və tutulma prosesləri göstərilmişdir.



Şəkil 2. Amfoter tipli hallarda elektron və deşiklərin tutulması və emissiya prosesləri.

Cədvəl 2-də şəkil 2-də təqdim olunan proseslərin izahı verilir.

Cədvəl 2.

Amfoter tipli hallarda elektron və deşiklərin tutulması və emissiya prosesləri prosesləri

Proses	Keçid	Prosesin sürəti
Elektronun tutulması	$D^e + e \rightarrow D^0$	$r_1 = n v_{th} \sigma_n^+ N_{DB} F^+$
Elektronun emissiyası	$D^0 \rightarrow D^+ + e$	$r_2 = e_n^0 N_{DB} F^0$
Elektronun tutulması	$D^0 + e \rightarrow D^-$	$r_3 = n v_{th} \sigma_n^0 N_{DB} F^0$
Elektronun emissiyası	$D^- \rightarrow D^0 + e$	$r_4 = e_n^- N_{DB} F^-$
Deşiyin tutulması	$D^0 + h \rightarrow D^+$	$r_5 = p v_{th} \sigma_p^0 N_{DB} F^0$
Deşiyin emissiyası	$D^+ \rightarrow D^0 + h$	$r_6 = e_p^+ N_{DB} F^+$
Deşiyin tutulması	$D^- + h \rightarrow D^0$	$r_7 = pv_{th} - N_{DB}F^-$

Cədvəldə D – qırılmış rabitə, F – tutulma funksiyası, «+», «0» və «–» indeksləri isə qırılmış rabitənin yük halıdır.

Bu halda emissiya əmsalları belə ifadə olunacaqdır:

$$\begin{split} e_n^0 &= 0.5 v_{th} \sigma_n^+ N_C exp\left(\frac{E^{+/0} - E_C}{kT}\right); \\ e_n^- &= 2 v_{th} \sigma_n^0 N_C exp\left(\frac{E^{0/-} - E_C}{kT}\right). \\ e_t^+ &= 2 v_{th} \sigma_p^0 N_V exp\left(\frac{E_V - E^{+/0}}{kT}\right); \\ e_n^0 &= 0.5 v_{th} \sigma_p^- N_V exp\left(\frac{E_V - E^{0/-}}{kT}\right). \end{split}$$

Yük halları üçün tutulma funksiyası:

$$F^{+} = \frac{P^{0}P^{-}}{N^{+}P^{-} + P^{0}P^{-} + N^{+}N^{0}};$$
  
$$F^{0} = \frac{N^{+}P^{-}}{N^{+}P^{-} + P^{0}P^{-} + N^{+}N^{0}};$$

burada,  $N^{+} = n \cdot v_{th} \cdot \sigma_{n}^{+} + e_{p}^{+}$ ;  $N^{0} = n \cdot v_{th} \cdot \sigma_{n}^{0} + e_{p}^{0}$ ;  $P^{-} = p \cdot v_{th} \cdot \sigma_{p}^{-} + e_{n}^{-}$ ;  $P^{0} = p \cdot v_{th} \cdot \sigma_{p}^{0} + e_{n}^{0}$ . Bu ifadələrdən istifadə edərək, rekombinasiya effektivliyini təyin edirik:

$$\eta_r = r_1 - r_2 + r_3 - r_4 = v_{th}^2 (pn - n_i^2) \frac{\sigma_n^+ \sigma_p^0 P^- + \sigma_n^0 \sigma_p^- N^+}{N^+ P^- + P^0 P^- + N^+ N^0}$$

Bir qırılmış rabitəyə uyğun gələn orta yük isə belə təyin olunur:

$$Q = q \cdot (F^+ - F^-).$$

# NƏTİCƏ

Kristallik yarımkeçiricilərin qadağan zonasında rekombinasiya mərkəzləri kimi təsir edən yalnız diskret səviyyələr mövcud olduğundan, rekombinasiya proses-

- М.С. Нечаев, Д.Ю. Паращук. Квантово-химическое исследование новых редокс-медиаторов на основе комплексов меди и кобальта для фото-электрохимических солнечных батарей. Вестник Московского университета. (Серия 3). 2012, № 6, с. 67-70.
- [2] *R. Loganathan et al.* Journal of Alloys and Compounds, 2014, 616, p. 363-371, (IF 2.726).

ləri Şokli-Rid-Holl modeli ilə təsvir olunacaqdır. Bir qayda olaraq, ümumi fəza yükünə qadağan zonasında tutulmuş hallardakını yük daşıyıcıların verdiyi əlavəni hallar sıxlığının aşağı qiymətə malik olması səbəbindən nəzərə almamaq mümkündür. Amorf silisiumun yürüklük dəliyində elektron hallarının kvazikəsilməz paylanması mövcuddur ki, bu şərt də materialın elektron xassələrinə nəzərəçarpacaq dərəcədə təsir edir.

- [3] Ю.Д. Арбузов, В.М. Евдокимов. Основы фотоэлектричества. М.: Изд-во ГНУ ВИЭСХ, 2007. 292 с.
- [4] H. Lindstrom, A. Holmberg, E. Magnusson et al. A New Method for Manufacturing Nanostructured Electrodes on Plastic Substrates. Nano Letters. 2001, 1 (2), p. 97-100.

### E.A. Kerimov, S.N. Musayeva

## EMISSION PROCESSES IN SOLAR ELEMENTS BASED ON α-Si:H

Models of donor- and acceptor-like states, as well as amphoteric states in the  $\alpha$ -Si:H mobility gap, were used to estimate the charge of carriers trapped on states in the forbidden zone trap. It is assumed that the states at the tail of the conduction band are acceptor-like: they are negative when occupied by an electron and neutral when free of an electron. The states at the tail of the valence band have donor-like behavior, while the donor- and acceptor-like states at the tails of the zones have an exponential distribution.

#### Э.А. Керимов, С.Н. Мусаева

### ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭМИССИИ В СОЛНЕЧНЫХ Элементах на основе α-Si:H

Для оценки заряда носителей, захваченных на состояния в запрещенной зоне  $\rho_{trap}$ , использовались модели доноро- и акцептороподобных состояний, а также состояний амфотерного типа в щели подвижности  $\alpha$ -Si:H. Принимается, что состояния на хвосте зоны проводимости являются акцептороподобными: они отрицательны, когда заняты электроном, и нейтральны, когда свободны от электрона. Состояния на хвосте валентной зоны имеют донороподобное поведение, доноро- и акцептороподобные состояния на хвостах зон –экспоненциальное распределение.

Qəbul olunma tarixi: 17.01.2023